

EINLADUNG

Zeit: Freitag, 26. Januar 2007, 14.00 Uhr

Ort: Raum 5052, Ahornstr. 55

Referent: Dipl.-Inform. Thomas von der Maßen

Thema: **Feature-basierte Modellierung und Analyse von Variabilität in Produktlinienanforderungen**

Abstract Die Entwicklung einer Software-Produktlinie stellt hohe Ansprüche an alle Aktivitäten des Entwicklungsprozesses, insbesondere auch an das Requirements Engineering. Als besondere Herausforderung gilt die Berücksichtigung von Variabilität in Anforderungen.

Obwohl es eine Reihe von Variabilitäts-Modellierungsansätzen gibt, die größtenteils auf der Feature-Modellierung beruhen, fehlte bislang eine systematische Integration der Variabilitätsmodellierung im Kontext des Requirements Engineering. Insbesondere wurde bisher nicht berücksichtigt, welche Kriterien herangezogen werden müssen, um die zentralen Qualitäten Adäquatheit und Widerspruchsfreiheit von Anforderungsmodellen bewerten zu können, in denen Variabilität modelliert wurde.

Zunächst wird ein Metamodell für die Variabilitätsmodellierung präsentiert, welches die benötigten Konzepte und ihre Beziehungen verdeutlicht. Im Anschluss wird dargestellt, wie die Modellierung von Variabilität die Qualitätsmerkmale Adäquatheit und Widerspruchsfreiheit von Feature-Modellen beeinflussen kann. Es wird eine Kategorisierung von Defiziten vorgestellt, die sich aus dem Zusammenspiel von Variabilität und Abhängigkeiten zwischen variablen Anforderungen ergeben und ein Vorgehen erläutert, wie ein defizitbehaftetes Feature-Modell in eine so genannte normalisierte Form überführt werden kann. In Bezug auf die Adäquatheit wird der Variationsgrad eingeführt, der als Maß für die Anzahl von Produktspezifikationen dient, die auf Basis eines Feature-Modells abgeleitet werden können.

Abschließend wird eine prototypische Werkzeugunterstützung skizziert, welche die Feature-Modellierung unterstützt und die Qualität von Feature-Modellen in Bezug auf ihre Adäquatheit und Widerspruchsfreiheit hin analysiert.

Es laden ein: Die Dozenten der Informatik